

CEI 61243-1
(Première édition – 1993)

**Travaux sous tension –
DéTECTEURS de tension –
Partie 1 : DéTECTEURS de type capacitifs
pour usage sur des tensions alternatives
de plus de 1 kV**

IEC 61243-1
(First edition – 1993)

**Live working –
Voltage detectors –
Part 1: Capacitive type to be used for
voltages exceeding 1 kV a.c.**

CORRIGENDUM 2

Page 6

2 Références normatives

À la page 8, supprimer:

CEI 410:1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

Ajouter la publication suivante:

ISO 2859-1:1999, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 1: Procédures d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)*

Page 68

Annexe C

Généralités

Premier alinéa

Au lieu de:

... dans la CEI 410,

lire :

.. dans l'ISO 2859-1,

Deuxième alinéa

Supprimer ce qui suit :

Le nombre d'échantillons:

Tel que défini dans les articles de prescriptions.

Mai 2000

Page 7

2 Normative references

On page 9, delete:

IEC 410:1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

Add the following publication:

ISO 2859-1:1999, *Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection*

Page 69

Annex C

General

First paragraph

Replace the first paragraph by the following:

The sampling procedure does not follow in its entirety the sampling procedure developed in ISO 2859-1, for a single sampling plan for normal inspection.

Second paragraph

Delete the following:

Number of samples :

As defined in requirement clauses.

May 2000